



表面計測・解析技術セミナー2013 開催のご案内
(ブルカー・エイエックスエス株式会社 ナノ表面計測事業部からのご案内)

お客様各位

拝啓 時下ますますご清栄の段お喜び申し上げます。

日ごろは格別なるお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、弊社では「表面計測・解析技術セミナー2013」を開催する運びとなりました。

弊社の製品ラインナップである AFM(原子間力顕微鏡)、3次元白色光干渉型顕微鏡、多機能トライボロジーテスターのそれぞれに関連する最新の測定技術・解析技術について紹介させていただきます。

また、目玉の企画として、特別講師の方をお招きして招待講演を行います。

ご多用の所誠に恐縮でございますが、皆様のご参加を心よりお待ちしております。 敬具

ブルカー・エイエックスエス株式会社
ナノ表面計測事業部 事業部長 相川重夫

【特別講師のご紹介】

◆ 国立大学法人九州大学 教授工学研究院機械工学部門 澤江 義則様

(11月13日 大阪会場)

澤江先生は水素雰囲気におけるシール用樹脂材料のトライボロジー、生体関節および人工関節のバイオトライボロジーとバイオエンジニアリング等の研究の第一線で活躍しておられます。

当日は高圧水素ガスインフラの普及を目指した高分子トライボロジー研究に関してご講演頂ける予定です。

◆ 国立大学法人名古屋大学 教授大学院理学研究科長 篠原 久典 様

(11月14日 大阪会場)

篠原先生はナノカーボン(フラーレン・カーボンナノチューブ・グラフェン)研究の世界的な権威であります。当日はナノカーボンの創製、評価と応用に関してご講演頂ける予定です。

◆ 関西学院大学 教授 SiC 材料・プロセス研究開発センター長 大谷 昇 様

(11月14日 大阪会場)

大谷先生は SiC 単結晶製造技術において日本の第一人者であります。

当日は革新的省エネルギー技術として期待されている、パワーデバイス用 SiC 単結晶ウェーハのバルク及び表面欠陥についてご講演頂ける予定です。

◆ 国立大学法人東北大学 准教授 原子分子材料科学高等研究機構 中嶋健 様

(11月20日 東京会場)

中嶋先生は AFM の高分子への応用における先駆的な業績で知られており、数多くの企業から共同研究を依頼されておられます。

当日は AFM によるナノ力学物性解析とその高分子材料への応用についてご講演頂ける予定です。

◆ 株式会社日産アーク取締役 叶 際平 様

(11月20日 東京会場)

叶様は様々な分析・解析に携わってこられ、数々の先進的な論文を発表されてきました。

ご講演では株式会社日産アーク様が注力されているリチウムイオン二次電池の分析・解析に関するお話しをお聞かせ頂ける予定です。

【セミナー開催概要】

- 日時： 11 月 13 日(水) 大阪会場 13:00～17:00
11 月 14 日(木) 大阪会場 11:20～18:10
11 月 20 日(水) 東京会場 10:00～16:40
11 月 21 日(木) 東京会場 13:00～16:30
※各日程共にセミナー終了後に簡単な懇親会を開催させていただきます。
- 場所： 大阪会場 ブルカー・エイエックスエス株式会社 大阪オフィス
〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-29 テラサキ第2ビル 3階
地図： <http://www.bruker.jp/axs/nano/company/osaka.html>
東京会場 ブルカー・エイエックスエス株式会社 東京オフィス
〒104-0033 東京都中央区新川1-4-1 住友不動産六甲ビル 1階
地図： <http://www.bruker.jp/axs/nano/company/tokyo.html>

- 参加費： 無料

- お申込み方法： メール最後に記載の参加申込書に必要事項を御記入の上、メールまたは、FAXにてご送信ください。

- 内容： 開催日により内容が異なります。 以下プログラムをご参照下さい。

11 月 13 日(水) 大阪会場

～グリーントライボロジ技術を促進する表面解析における最新技術のご紹介～

時間	内容	講演者
13:00～13:05	ご挨拶	ブルカー・エイエックスエス株式会社 ナノ表面計測事業部 課長 秋本 壮一
13:05～14:05	グリーントライボロジ技術を 支援するオールインワン トライボロジーテスターの 実力	Bruker Nano Inc. Steven Shaffer ブルカー・エイエックスエス株式会社 ナノ表面計測事業部 鈴木 大輔
14:05～15:05	招待講演	国立大学法人 九州大学教授 工学研究院機械工学部門 澤江 義則様
15:05～15:20	休憩	
15:20～15:50	WYKO/白色光干渉顕微鏡の 最新動向	ブルカー・エイエックスエス株式会社 ナノ表面計測事業部 課長 秋本 壮一
15:50～16:50	実機による デモンストレーション	
16:50～17:00	Q&A / 閉会のご挨拶	
17:00～18:00	懇親会	

11 月 14 日(木) 大阪会場

～グリーンエネルギーや半導体、グラフェン、有機材料の研究を加速する測定技術～

時間	内容	講演者
11:20～11:25	ご挨拶	ブルカー・エイエックスエス株式会社 ナノ表面計測事業部 課長 秋本 壮一
11:25～12:00	AFM の最新製品 ラインアップの ご紹介	ブルカー・エイエックスエス株式会社 ナノ表面計測事業部 野尻 宏
12:00～13:00	昼食	
13:00～14:00	招待講演	国立大学法人 名古屋大学教授 大学院理学研究科長 篠原 久典 様
14:00～14:20	休憩	
14:20～15:50	高分解能の物性測定を実現する AFM の新技術 ～グリーンエネルギーや半導体、 グラフェン、有機材料の研究を加 速する測定技術～	Bruker Nano Inc. Peter Dewolf ブルカー・エイエックスエス株式会社 ナノ表面計測事業部 課長 後藤 千絵
15:50～16:50	実機による デモンストレーション	
16:50～17:00	休憩	
17:00～18:00	招待講演	関西学院大学教授 SiC 材料・プロセス研究開発センター長 大谷 昇 様
18:00～18:10	Q&A / 閉会のご挨拶	
18:10～19:00	懇親会	

11 月 20 日(水) 東京会場

高分解能の物性測定を実現する AFM の新技術

～グリーンエネルギーや半導体、グラフェン、有機材料の研究を加速する測定技術～

時間	内容	講演者
10:00～10:05	ご挨拶	ブルカー・エイエックスエス株式会社 ナノ表面計測事業部 事業部長 相川 重 夫
10:05～11:05	招待講演	国立大学法人 東北大学准教授 中嶋 健 様
11:05～12:05	招待講演	株式会社日産アーク 取締役 叶 際平 様
12:05～13:05	昼食	

13:05～13:40	AFM の最新製品ラインアップのご紹介	ブルカー・エイエックスエス株式会社 ナノ表面計測事業部 野尻 宏
13:40～15:10	高分解能の物性測定を実現する AFM の新技術 ～グリーンエネルギーや半導体、 グラフェン、有機材料の研究を加 速する測定技術～	Bruker Nano Inc. Thomas Muller ブルカー・エイエックスエス株式会社 ナノ表面計測事業部 課長 後藤 千絵
15:10～15:30	休憩	
15:30～16:30	実機による デモンストレーション	
16:30～16:40	Q&A / 閉会のご挨拶	
16:40～17:40	懇親会	

11 月 21 日(木) 東京会場

～グリーントライボロジ技術を促進する表面解析における最新技術のご紹介～

時間	内容	講演者
13:00～13:05	ご挨拶	ブルカー・エイエックスエス株式会社 ナノ表面計測事業部 課長 秋本 壮一
13:05～14:05	グリーントライボロジ技術を 支援するオールインワン トライボロジー テスターの実力	Bruker Nano Inc. Steven Shaffer ブルカー・エイエックスエス株式会社 ナノ表面計測事業部 鈴木 大輔
14:05～15:05	WYKO 最新動向&摩擦・摩耗・腐食 表面における視覚化 アプローチと各種パラメータの有効 性	ブルカー・エイエックスエス株式会社 ナノ表面計測事業部 古嶋 康志
15:05～15:20	休憩	
15:20～16:20	実機による デモンストレーション	
16:20～16:30	Q&A / 閉会のご挨拶	
16:30～17:30	懇親会	

COPYRIGHT © 2013 Bruker AXS K.K. Nano Surfaces Business